

证书号第7955171号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称：一种半导体芯片的高低温测试设备

专利权人：广东宏展科技有限公司

地址：523000 广东省东莞市常平镇土塘村红花岭地段长城聚怡大厦一楼东面厂房

发明人：薛泽明

专利号：ZL 2024 1 1732671.7

授权公告号：CN 119511040 B

专利申请日：2024年11月29日

授权公告日：2025年05月23日

申请日时申请人：广东宏展科技有限公司

申请日时发明人：薛泽明

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨

